

SECCION G – FISICA

G01 METROLOGIA; ENSAYOS

G01Q TECNICAS O APARATOS DE SONDA DE BARRIDO; APLICACIONES DE TECNICAS DE SONDA DE BARRIDO, P. EJ. MICROSCOPIA POR SONDA DE BARRIDO [SMP] [2010.01]

Nota

En esta subclase se aplica la regla del primer lugar, es decir, en cada nivel jerárquico se clasifica en el primer lugar apropiado. [2010.01]

-
- | | | | |
|-------|--|-------|---|
| 10/00 | Disposiciones para barrido o posicionamiento, es decir, disposiciones para controlar de forma activa el movimiento o posición de la sonda [2010.01] | 60/06 | . . SNOM [Microscopía Óptica de Barrido en Campo Cercano] combinada con AFM [Microscopía de Fuerza Atómica] [2010.01] |
| 10/02 | . Barrido o posicionamiento basto [2010.01] | 60/08 | . . MFM [Microscopía de Fuerza Magnética] combinada con AFM [Microscopía de Fuerza Atómica] [2010.01] |
| 10/04 | . Barrido o posicionamiento fino [2010.01] | 60/10 | . STM [Microscopía de Efecto Túnel] o aparatos empleados, p. ej. sondas [2010.01] |
| 10/06 | . . Circuitos o algoritmos al efecto [2010.01] | 60/12 | . . STS [Espectroscopía de Efecto Túnel] [2010.01] |
| 20/00 | Monitorización del movimiento o de la posición de la sonda [2010.01] | 60/14 | . . STP [Potenciometría de Efecto Túnel] [2010.01] |
| 20/02 | . por medios ópticos [2010.01] | 60/16 | . . Sondas, su fabricación o su instrumentación relacionada, p. ej. soportes [2010.01] |
| 20/04 | . Sondas auto detectoras, es decir, en las que la sonda en sí misma genera una señal representativa de su posición, p. ej. galgas piezoeléctricas [2010.01] | 60/18 | . SNOM [Microscopía Óptica de Barrido en Campo Cercano] o aparatos empleados, p. ej. sondas SNOM [2010.01] |
| 30/00 | Medios auxiliares destinados a asistir o mejorar las técnicas o aparatos de sonda de barrido, p. ej. dispositivos de visualización o de procesamiento de datos [2010.01] | 60/20 | . . Fluorescencia [2010.01] |
| 30/02 | . Dispositivos de análisis de un tipo distinto al de microscopía de barrido [SPM], p. ej. microscopio electrónico de barrido [SME], espectrómetro o microscopio óptico [2010.01] | 60/22 | . . Sondas, su fabricación o su instrumentación relacionada, p. ej. soportes [2010.01] |
| 30/04 | . Dispositivos de visualización o de procesamiento de datos [2010.01] | 60/24 | . AFM [Microscopía de Fuerza Atómica] o aparatos empleados, p. ej. sondas AFM [2010.01] |
| 30/06 | . . para compensar el error [2010.01] | 60/26 | . . Microscopía de fuerza de fricción [2010.01] |
| 30/08 | . Medios para crear o regular las condiciones ambientales dentro de una cámara de muestras [2010.01] | 60/28 | . . Microscopía de fuerza de adhesión [2010.01] |
| 30/10 | . . Condiciones térmicas [2010.01] | 60/30 | . . Microscopía por barrido de potencial [2010.01] |
| 30/12 | . . En medio fluido [2010.01] | 60/32 | . . Modo AC [2010.01] |
| 30/14 | . . . En medio líquido [2010.01] | 60/34 | . . . Modo de contacto intermitente [2010.01] |
| 30/16 | . . Bajo vacío [2010.01] | 60/36 | . . Modo DC [2010.01] |
| 30/18 | . Medios para proteger o aislar el interior de una cámara de muestras de las condiciones ambientales externas, p. ej. vibraciones o campos electromagnéticos [2010.01] | 60/38 | . . Sondas, su fabricación o su instrumentación relacionada, p. ej. soportes [2010.01] |
| 30/20 | . Dispositivos o métodos para manejar las muestras [2010.01] | 60/40 | . . . Sondas conductoras [2010.01] |
| 40/00 | Calibración, p. ej. sondas [2010.01] | 60/42 | . . . Funcionalización [2010.01] |
| 40/02 | . Patrones de calibración o métodos para fabricarlos [2010.01] | 60/44 | . SICM [Microscopía de Barrido de Conductancia Iónica] o aparatos empleados, p. ej. sondas SICM [2010.01] |
| 60/00 | Tipos particulares de microscopía por sonda de barrido [SPM] o aparatos empleados; Componentes esenciales al efecto [2010.01] | 60/46 | . SCM [Microscopía de Barrido de Capacitancia] o aparatos empleados, p. ej. sondas SCM [2010.01] |
| 60/02 | . Microscopía por sonda de barrido [SPM] que emplea dos o más técnicas distintas [2010.01] | 60/48 | . . Sondas, su fabricación o su instrumentación relacionada, p. ej. soportes [2010.01] |
| 60/04 | . . STM [Microscopía de Efecto Túnel] combinada con AFM [Microscopía de Fuerza Atómica] [2010.01] | 60/50 | . MFM [Microscopía de Fuerza Magnética] o aparatos empleados, p. ej. sondas MFM [2010.01] |
| | | 60/52 | . . Resonancia [2010.01] |
| | | 60/54 | . . Sondas, su fabricación o su instrumentación relacionada, p. ej. soportes [2010.01] |
| | | 60/56 | . . . Sondas con recubrimiento magnético [2010.01] |
| | | 60/58 | . SThM [Microscopía Térmica de Barrido] o aparatos empleados, p. ej. sondas SThM [2010.01] |
| | | 60/60 | . SECM [Microscopía Electroquímica de Barrido] o aparatos empleados, p. ej., sondas SECM [2010.01] |

70/00	<i>Aspectos generales de las sondas SPM, de su fabricación o de su instrumentación relacionada, en tanto en cuanto no están adaptados a una única técnica SPM cubierta por el grupo G01Q 60/00 [2010.01]</i>	70/16	. Fabricación de las sondas [2010.01]
70/02	. Soportes de sondas [2010.01]	70/18	. . Funcionalización [2010.01]
70/04	. . con compensación de los errores causados por la temperatura o las vibraciones [2010.01]	80/00	<i>Aplicaciones de las técnicas de sonda de barrido distintas de la SPM (fabricación o tratamiento de microestructuras B81C; fabricación o tratamiento de nanoestructuras B82B 3/00; grabación o reproducción de información empleando la interacción del campo próximo G11B 9/12, G11B 11/24 or G11B 13/08) [2010.01]</i>
70/06	. Conjuntos de puntas de sondas [2010.01]	90/00	<i>Técnicas o aparatos de sonda de barrido no previstos en otro lugar [2010.01]</i>
70/08	. Características de las sondas [2010.01]		
70/10	. . Forma o conicidad [2010.01]		
70/12	. . . Puntas de nanotubos [2010.01]		
70/14	. . Materiales particulares [2010.01]		